



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

一种低维导电材料的弯曲疲劳可靠性测试系统

文献类型：专利

作者 张广平, 徐进, 张滨 and 宋竹满

发表日期 2012-05-09

专利国别 中国

专利类型 实用新型

权利人 中国科学院金属研究所

中文摘要 本实用新型涉及对低维导电材料的疲劳性能测试系统的建立,具体为一种低维导电材料的弯曲疲劳可靠性的测试系统,解决现有技术中存在的对导电薄膜材料疲劳寿命测量误差大、无法准确测量裂纹的萌生寿命等问题。该测试系统由电磁驱动部分、疲劳加载与测量部分以及检测与记录部分组成,电磁驱动部分包括数字函数发生器、功率放大器、电磁转换器;疲劳加载与测量部分包括楔形槽震动杆、被测导电试样、试样夹具、螺旋测微器和测微器探头;检测与记录部分包括多通路数字万用表和与多通路数字万用表相连的PC机。该系统可以同时多个被测导电试样进行疲劳性能实验,并可同时对每个被测导电试样的电阻值进行实时记录与分析,实验操作简单快捷。

公开日期 2012-05-09

语种 中文

专利申请号 CN202216931U

源URL [<http://210.72.142.130/handle/321006/66675>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 张广平, 徐进, 张滨 and 宋竹满. 一种低维导电材料的弯曲疲劳可靠性测试系统. 2012-05-09.

GB/T 7714

入库方式：OAI收割

来源：[金属研究所](#)

浏览

107

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

